

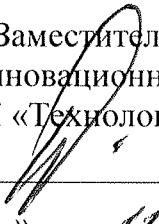
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Старший инженер 512 ВП МО РФ


А.Р. Чириченко
« 13 » 11 2019г.

Заместитель директора
по инновационной деятельности
НПК «Технологический центр»


В.Г. Сницар
« 13 » 11 2019г.

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ

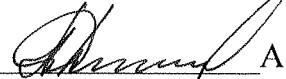
5529TP044, 5529TP044A

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТ

ГАВЛ.431268.015Д1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1485				

Главный конструктор изделия


А.Н. Денисов
« 13 » 11 2019г.

НАЗНАЧЕНИЕ, СХЕМО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ,
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Перв. примен.

ГАВЛ.431268.015

Справ. №

Инв. № подп. Подп. и дата
ГАВЛ.431268.015

Микросхемы интегральные 5529TP044, 5529TP044A представляют собой многофункциональные цифровые матрицы, выполненные по полупроводниковой технологии на МОП-транзисторах.

Микросхемы предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения. Количество элементов в схеме электрической (количество эквивалентных вентилей), не менее - 1600000 (400000).

Конструктивное исполнение для микросхемы 5529TP044 в корпусе МК 4247.100-3 приведено на рисунке 1, для микросхемы 5529TP044A в корпусе МК 4239.68-2 приведено на рисунке 2.

Схема электрическая структурная микросхемы представлена на рисунке 3. Схема электрическая структурная периферийной ячейки приведена на рисунке 4.

Электрические параметры микросхемы приведены в таблице 1. Предельные и предельно-допустимые значения электрических режимов эксплуатации микросхемы приведены в таблице 2.

Таблицы назначения выводов микросхем приведены в картах заказа соответствующих регистрационных номеров.

Пример обозначения микросхем при заказе (в договоре на поставку):

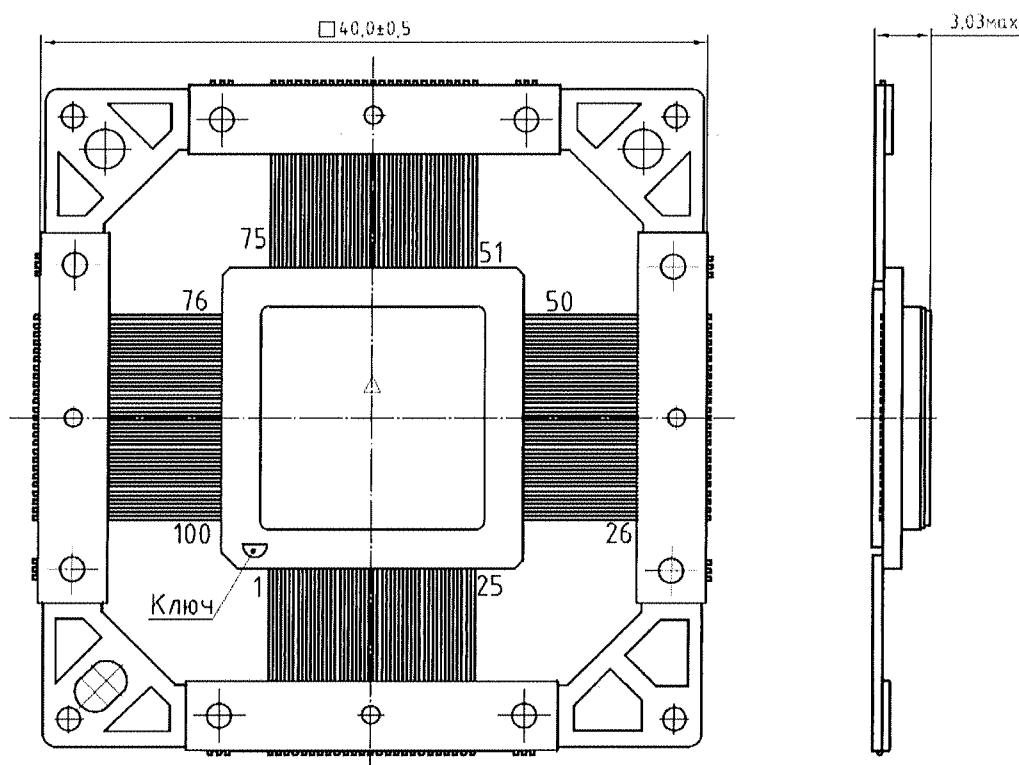
- микросхема 5529TP044-X¹⁾ – АЕНВ.431260.290ТУ, корпус МК 4247.100-3, карта заказа²⁾;
- микросхема 5529TP044A-X¹⁾ – АЕНВ.431260.290ТУ, корпус МК 4239.68-2, карта заказа²⁾;

¹⁾ X – Регистрационные номера карт заказа (цифровые или буквенно-цифровые коды), указанные в обозначении полузаизных микросхем на основе БК в соответствии с АЕНВ.431260.290ТУ.

²⁾ Децимальные номера карт заказа в соответствии с АЕНВ.431260.290ТУ.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ГАВЛ.431268.015Д1				
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
					Разраб.	Астахова	<i>Рад</i>		13.11.19
					Пров.	Тикашкин	<i>В.Н.</i>		13.11.19
					Н. контр.	Казаков	<i>А.А.</i>		10.11.19
					Утв.	Денисов	<i>Денисов</i>		13.11.19
Микросхемы интегральные 5529TP044, 5529TP044A Справочный лист									
Лит. Лист Листов									
А 2 29									

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



Знак чувствительности микросхем к СЭ обозначен равносторонним треугольником (Δ). Первый вывод микросхемы находится в левом нижнем углу корпуса. Левый нижний угол определяется по фаске на корпусе. Первым выводом является левый нижний вывод корпуса. Нумерация выводов – против часовой стрелки.

Нумерация выводов показана условно.

Рисунок 1 – Микросхема интегральная 5529TP044

Корпус МК 4247.100-3

Металлокерамический

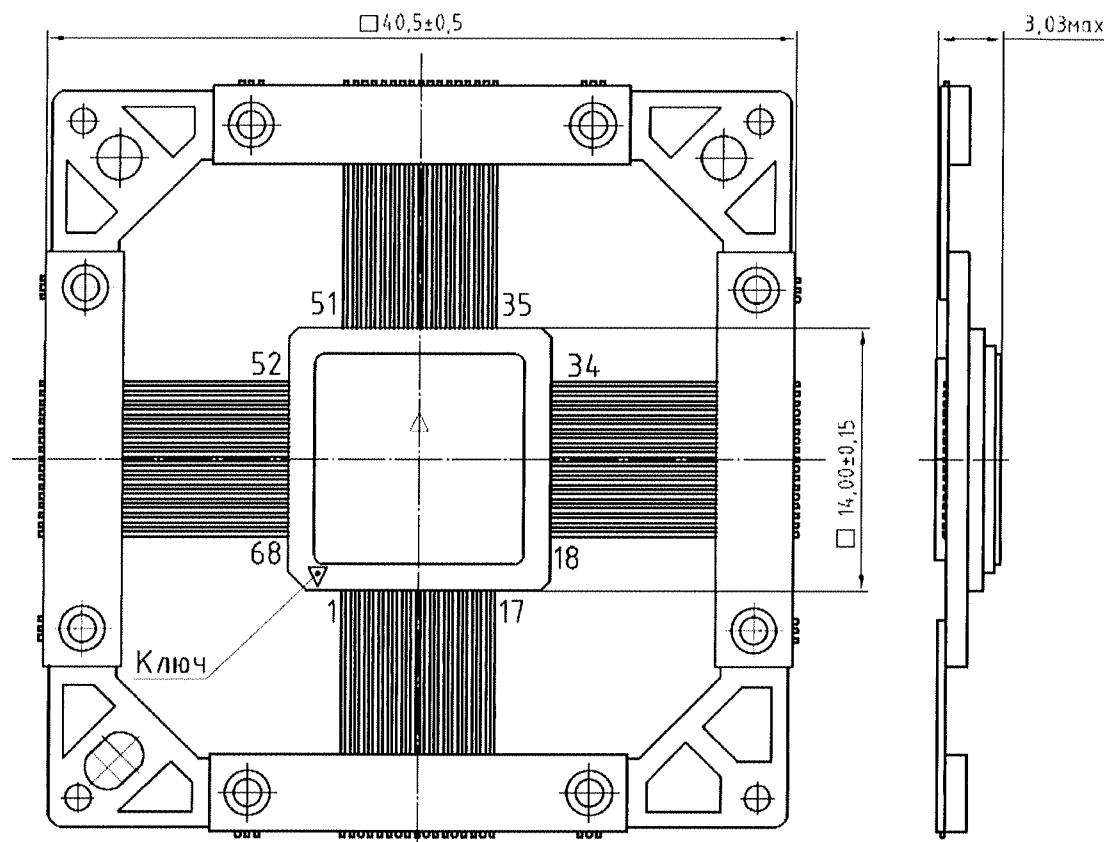
Материал покрытия выводов: золото

Общее содержание драгметаллов в готовом изделии соответствует данным этикетки ГАВЛ.431268.015ЭТ.

Масса микросхемы не должна превышать 5,5 г.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
14495	Баринов А.Ю.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.015Д1	Лист
						3



Знак чувствительности микросхем к СЭ обозначен равносторонним треугольником (Δ). Первый вывод микросхемы находится в левом нижнем углу корпуса. Левый нижний угол определяется по фаске на корпусе. Первым выводом является левый нижний вывод корпуса. Нумерация выводов – против часовой стрелки.

Нумерация выводов показана условно.

Рисунок 1 – Микросхема интегральная 5529TP044А

Корпус МК 4239.68-2

Металлокерамический

Материал покрытия выводов: золото

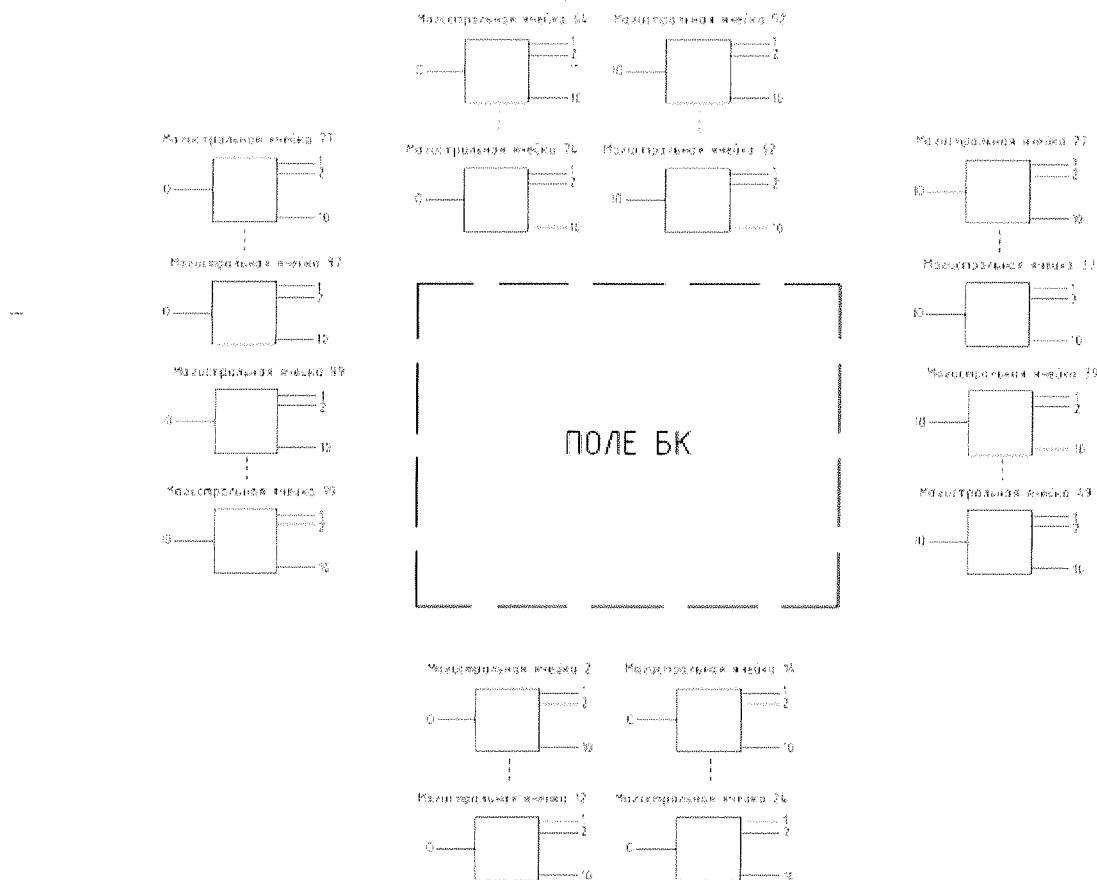
Общее содержание драгметаллов в готовом изделии соответствует данным этикетки ГАВЛ.431268.015-01ЭТ.

Масса микросхемы не должна превышать 4,0 г.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
1729Б	Документ			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.015Д1	Лист
						4

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА



1. Нумерация выводов ячеек приведена условно. Обозначения выводов приведены в соответствующей регистрационному номеру карте заказа.
2. Нумерация ячеек поля соответствует номеру столбца ячеек в поле микросхемы и порядковому номеру в столбце.
3. Магистральные ячейки 1, 25, 38, 51, 75, 88 (на схеме не показаны) соответствует контакту «Земля».
4. Магистральные ячейки 13, 26, 50, 63, 76, 100 (на схеме не показаны) соответствует контакту «Питание»

Рисунок 3 - Схема электрическая структурная микросхем 5529TP044, 5529TP044A

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
14405	Лист 40 из 40.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.015Д1

Лист

5

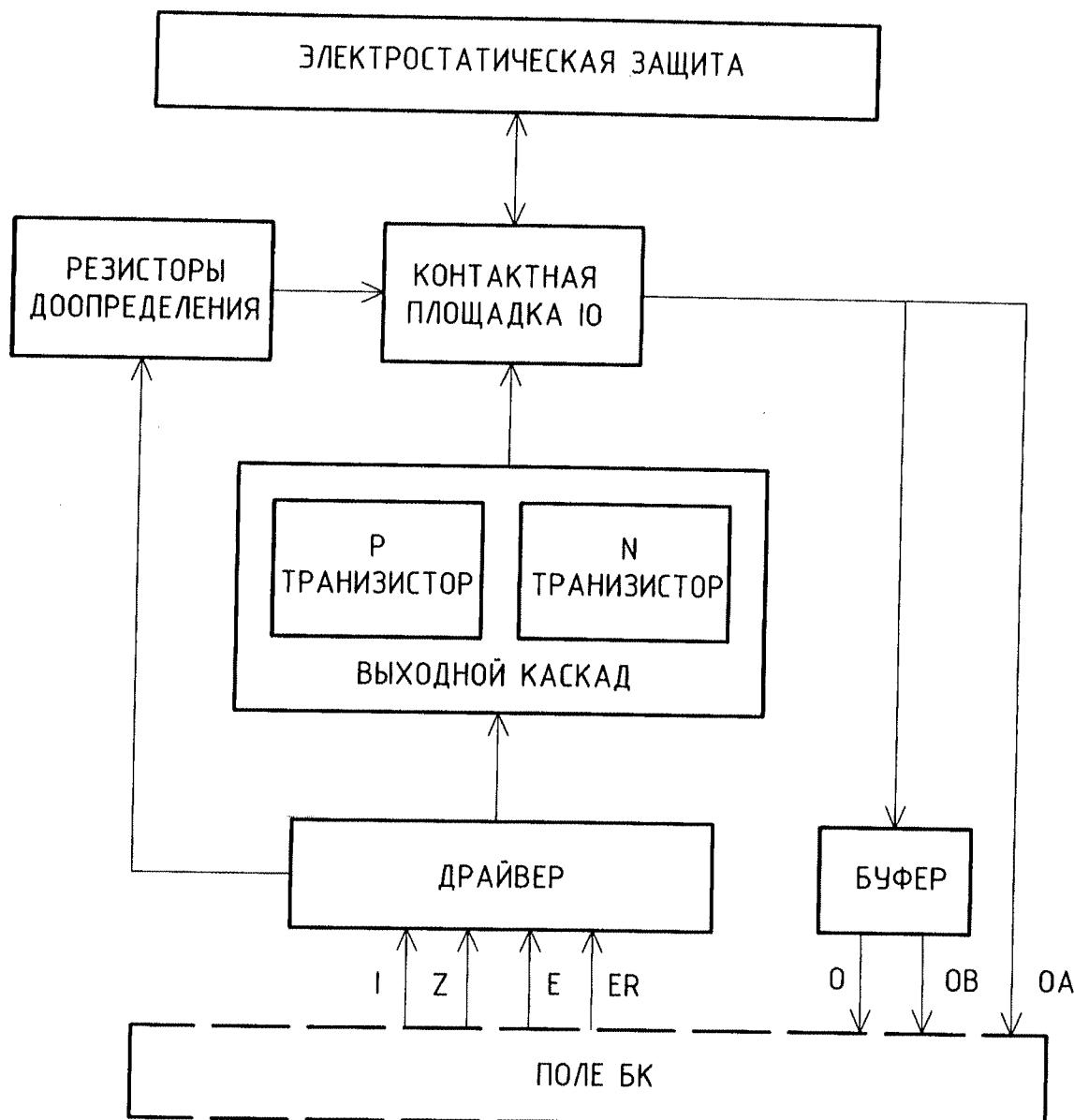


Рисунок 4 – Схема электрическая структурная периферийной ячейки

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
Гавл	Гавл 26.01.06			

ГАВЛ.431268.015Д1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					6

ДОПУСТИМЫЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Механические факторы

1 Синусоидальная вибрация	
Диапазон частот, Гц	1 – 5000
Амплитуда ускорения, м/с ² (g)	400 (40)
2 Удары одиночного действия в любом направлении	
Амплитуда пикового ударного ускорения, м/с ² (g)	15000 (1500)
Длительность действия ударного ускорения, мс	0,1 – 2,0
3 Удары многократного действия в любом направлении	
Амплитуда пикового ударного ускорения, мс (g)	1500 (150)
Длительность действия ударного ускорения, мс	1–5
4 Линейное ускорение в любом направлении	
Амплитуда линейного ускорения, м/с ² (g)	5000 (500)
5 Акустический шум	
Диапазон частот, Гц	50 –10000
Уровень звукового давления (относительно 0,00002 Па), дБ	170

Климатические факторы

1 Атмосферное пониженное рабочее давление, Па (мм рт. ст.)	1,3x10 ⁻⁴ (10 ⁻⁶)
2 Повышенное рабочее давление, кПа(мм рт. ст.)	294(2205)
3 Повышенная температура среды: рабочая, °C	+85
предельная, °C	+125
4 Пониженная температура среды: рабочая, °C	минус 60
предельная, °C	минус 60
5 Смена температур: от пониженной предельной температуры среды, °C	минус 60
до повышенной предельной температуры среды, °C	+125
6 Повышенная относительная влажность при 35°C, %	98*

Вид исполнения по ГОСТ РВ 20.39.414.1

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата
1785	Документ			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.015Д1	Лист
						7

7 Атмосферные конденсированные осадки (роса, иней)	*
8 Соляной (морской) туман	*
9 Плесневые грибы	
10 Статическая пыль	**
11 Контрольные среды (среды заполнения), объемная доля компонентов контрольной среды, %	
гелиево-воздушная	90
аргоно- воздушная	90
аргоно- азотная	90

*Соответствие микросхем данному требованию обеспечивается при условии их многослойного лакового покрытия в составе аппаратуры.

**Требования по устойчивости к воздействию статической пыли не предъявляются.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ГАВЛ 1485	Документ			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.015Д1

Лист

8

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон напряжения питания U_{CC} микросхем должно быть от 2,70 В до 3,63 В.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Таблица 1 – Электрические параметры микросхем при приёмке и поставке

Наименование параметра, обозначение единицы физической величины, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температу- ра среды ¹⁾ , С
		не менее	не более	
1 Выходное напряжение низкого уровня, В при $U_{CC}=2,7$ В, I_{OL} от 1 до 12,0 мА	U_{OL}	-	0,3	+25±10 -60 +85
2 Выходное напряжение высокого уровня, В при $U_{CC}=2,7$ В, I_{OH} от 1 до 12,0 мА	U_{OH}	$U_{CC}-0,3$	-	+25±10 -60 +85
3 Ток потребления статический, мА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=U_{CC}$, $U_{IL}=0$ В	I_{CC}	-	10,0 ²⁾ 30,0 ²⁾	+25±10 -60 +85
4 Токи утечки низкого и высокого уровней на входе, мкА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=U_{CC}$, $U_{IL}=0$ В	I_{ILL}, I_{ILH}	-1,0 -3,0	1,0 3,0	+25±10 -60 +85
5 Выходной ток низкого и высокого уровней в состоянии «Выключено» на выводах выход (вход/выход), мкА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{OZH}(U_{IOZH})=U_{CC}$, $U_{OZL}(U_{IOZL})=0$ В	I_{OZL}, I_{OZH}	-1,0 -3,0	1,0 3,0	+25±10 -60 +85
6 Ток доопределения внешнего вывода до низкого уровня, мА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=U_{CC}$, $U_{IL}=0$ В	I_{RL}	0,005	2,0	+25±10 -60 +85
7 Ток доопределения внешнего вывода до высокого уровня, мА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=U_{CC}$, $U_{IL}=0$ В	I_{RH}	0,005	2,0	+25±10 -60 +85

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
17495	Лист № 01			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					9

Окончание таблицы 1

Наименование параметра, обозначение единицы физической величины, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температура среды ¹⁾ , С
		не менее	не более	
8 Время задержки на вентиль ³⁾ , пс при $U_{CC}=3,63$ В, $C_L \leq 150$ пФ	t_{DB}	-	60,0	+25±10
			100,0	-60
				+85
9 Входная ёмкость, пФ	C_I	-	7,0	+25±10
			10,0	-60
				+85
10 Выходная ёмкость, пФ	C_O	-	7,0	+25±10
			10,0	-60
				+85
11 Ёмкость входа/выхода, пФ	$C_{I/O}$	-	7,0	+25±10
			10,0	-60
				+85

¹⁾ Погрешность задания температуры составляет ± 3 °С.

²⁾ Значения могут быть уточнены в карте заказа.

³⁾ В карте заказа могут устанавливаться другие динамические параметры с указанием метода контроля.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 2 – Предельно-допустимые и предельные электрические режимы эксплуатации микросхем

Наименование параметра, обозначение единицы физической величины, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимый режим		Предельный режим	
		не менее	не более	не менее	не более
1 Напряжение питания, В	U_{CC}	2,7	3,63	-0,4	4,0
2 Напряжение, прикладываемое к выводу закрытой микросхемы, В	U_{OZ}	0,0	U_{CC}	-0,4	$U_{CC}+0,4$, но не более 4,0
3 Входное напряжение низкого уровня, В	U_{IL}	0,0	0,4	-0,4	-
4 Входное напряжение высокого уровня, В	U_{IH}	($U_{CC}-0,4$)	U_{CC}	-	$U_{CC}+0,4$, но не более 4,0

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
17705	Дубль. О. А.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.015Д1	Лист
						10

Окончание таблицы 2

Наименование параметра, обозначение единицы физической величины, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимый режим		Предельный режим	
		не менее	не более	не менее	не более
5 Выходной ток низкого уровня, мА	I _{OL}	-	12,0	-	24,0
6 Выходной ток высокого уровня, мА	I _{OH}	-	12,0	-	24,0
7 Емкость нагрузки, пФ	C _L	-	150,0	-	250,0

НАДЕЖНОСТЬ

Наработка до отказа в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых АЕИВ.431260.290ТУ, должна быть не менее 140 000 ч при температуре окружающей среды не более $(65 + 5)^\circ\text{C}$ и не менее 200 000 ч в облегченном режиме при $U_{CC} = 3,0 \text{ В} \pm 5\%$, выходные токи I_{OL} , I_{OH} не более 50 % от предельно-допустимых значений, установленных в таблице 2.

Гамма – процентный срок сохраняемости ($T_{C\gamma}$) микросхем при $\gamma = 99\%$ при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемыми влажностью и температурой, или в местах хранения микросхем, вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплексе ЗИП, должен быть – 25 лет. Требования к показателям безотказности действуют в пределах срока службы T_{cl} , устанавливаемого численно равным $T_{C\gamma}$.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. №	Взам. инв. №	Подп. и дата
1485	26.07.00			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.015Д1	Лист
						11

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Порядок подачи и снятия напряжений питания и входных сигналов на микросхемы должен быть следующим:

- при включении на микросхемы сначала подается напряжение питания U_{CC} , а затем входные напряжения U_I , или одновременно;
- при выключении напряжение питания U_{CC} снимается последним или одновременно с входными напряжениями U_I .

Допускается работа микросхем при ёмкости нагрузки C_L до 250 пФ. При этом динамические параметры не гарантируются.

Неиспользуемые выводы микросхем допускается подключать к шине общего вывода GND (0 В) или к шине напряжения питания U_{CC} .

Допустимое значение потенциала СЭ – не более 2000 В при использовании стандартных периферийных ячеек и не более 1000 В при использовании периферийных ячеек без верхнего защитного диода, что указывается в картах заказа.

Нумерацию, обозначение, наименование выводов, дополнительные указания к этапу разработки аппаратуры приводят в картах заказа.

Рекомендуется установку и крепление микросхем на платы проводить в соответствии с рисунком 5. Вид формовки микросхем в соответствии с рисунком 6 для микросхемы 5529TP044 и в соответствии с рисунком 7 для микросхемы 5529TP044A.

Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре операциями пайки по ОСТ 11 073.063 при установке их на некерамические платы. Допустимое количество исправлений дефектов пайки отдельных выводов микросхемы – не более двух.

Способ установки микросхем на платы и их демонтажа должен обеспечивать отсутствие передачи усилий, деформирующих корпус.

Рекомендуется начинать пайку с выводов V_{CC} и GND (0 В). Пайку остальных выводов разрешается проводить в любой последовательности.

Устанавливать и извлекать микросхемы из контактных приспособлений, а также производить замену микросхем необходимо только при снятии напряжений со всех выводов микросхемы.

В непосредственной близости между выводами V_{CC} и выводами GND (0 В), указанными в картах заказа, должны быть подключены керамические конденсаторы

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Подл. и дата
12485	20.07.2010		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.015Д1	Лист
						12

емкостью не менее 0,3 мкФ и рабочим напряжением не менее 10 В. Необходимое количество и номиналы конденсаторов определяются разработчиком аппаратуры.

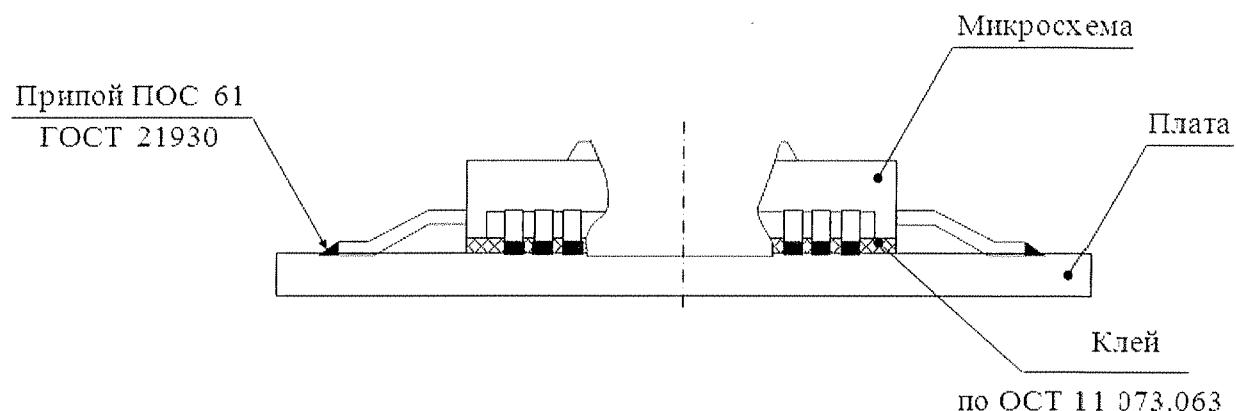


Рисунок 5 – Пример установки и крепления микросхем 5529TP044, 5529TP044A на плате

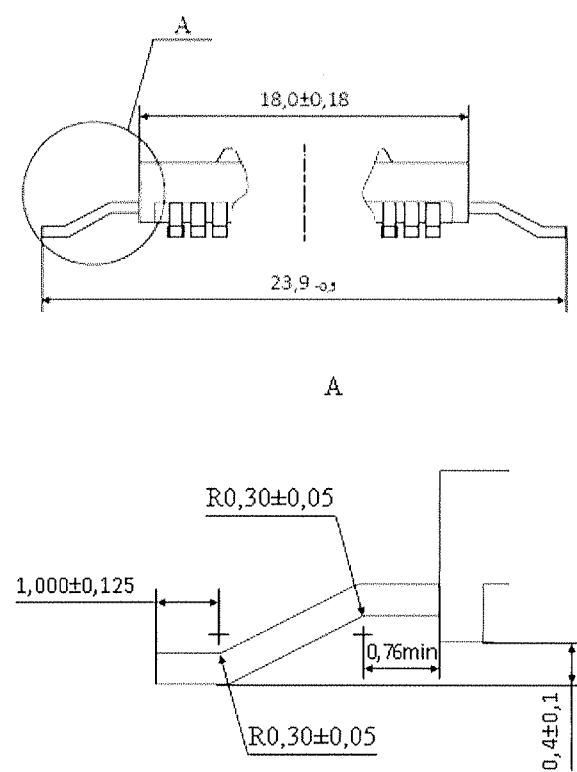


Рисунок 6 – Рекомендуемый вид формовки и обрезки выводов микросхем 5529TP044

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
1775	Д/д	Д/д	Д/д	Д/д

ГАВЛ.431268.015Д1

Лист

13

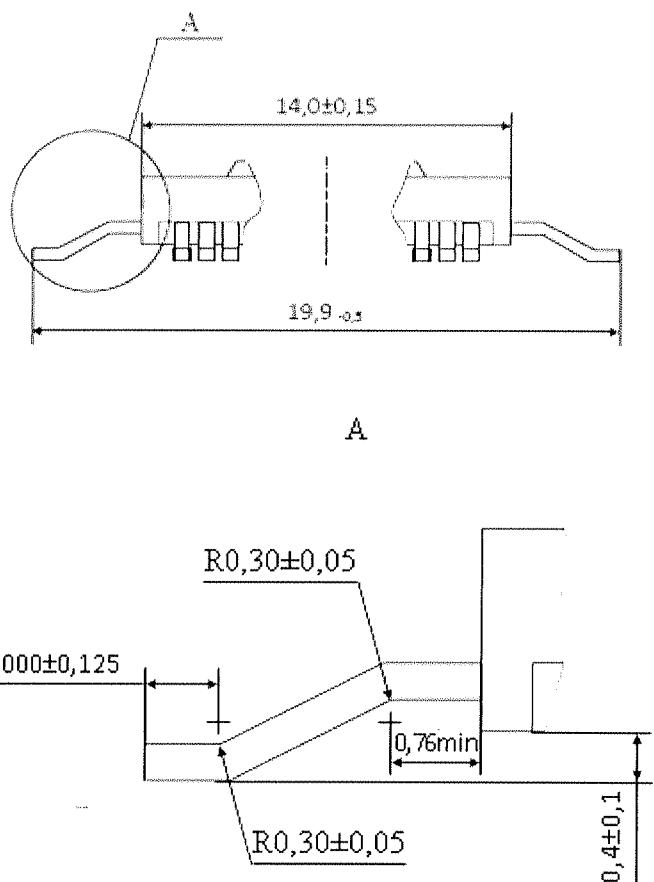


Рисунок 7 – Рекомендуемый вид формовки и обрезки выводов микросхем

5529TP044A

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
1325	Документ			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.015Д1	Лист
						14

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

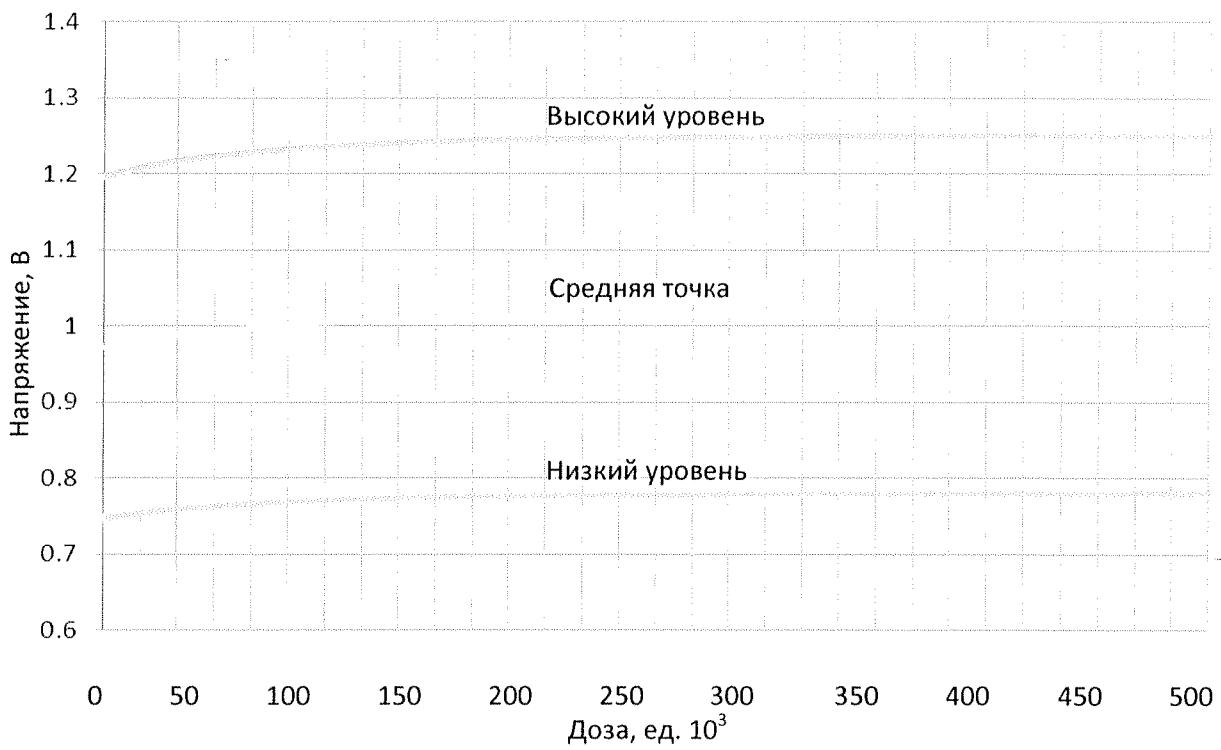


Рисунок 8 – Зависимости уровней выходного сигнала М–LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 2,7$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ГАВЛ	Документ			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.015Д1

Лист

15

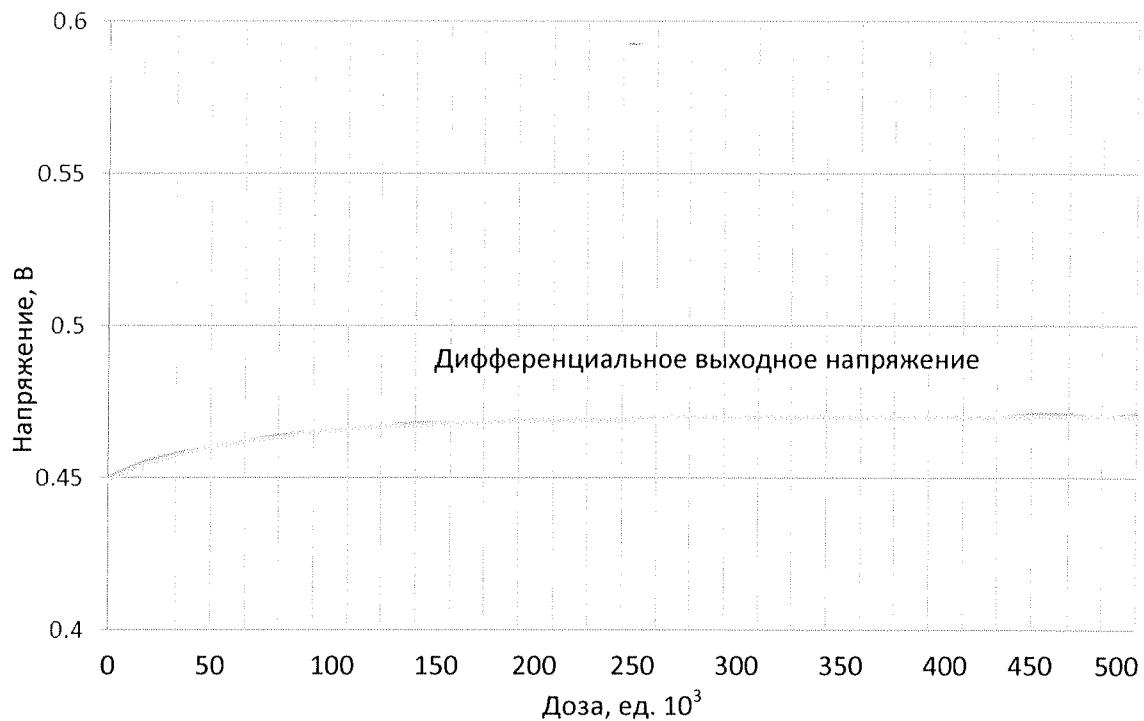


Рисунок 9 – Зависимости дифференциального выходного сигнала М–LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 2,7$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
14465	Лит. №. 01.01.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.015Д1	Лист
						16

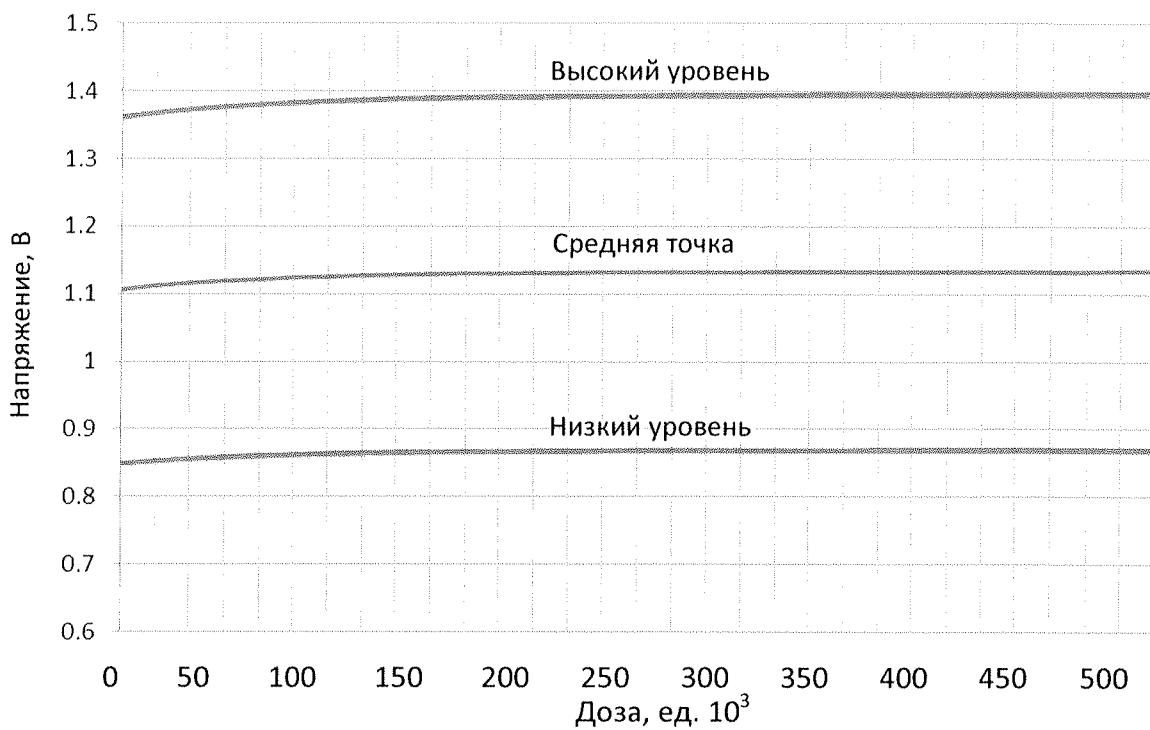


Рисунок 10 – Зависимости уровней выходного сигнала M–LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,0$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
14485	Лист № 10 из 20			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.015Д1	Лист
						17

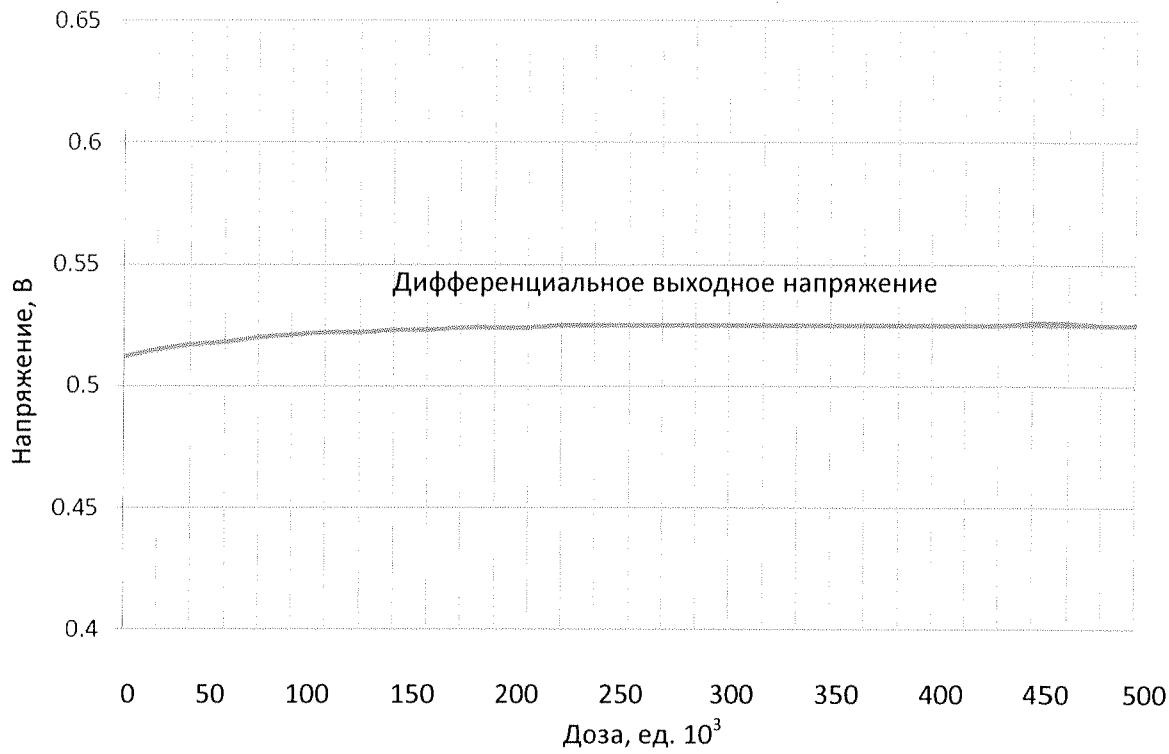


Рисунок 11 – Зависимости дифференциального выходного сигнала М–LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,0$ В

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
1485	Лит. 01. 10.			

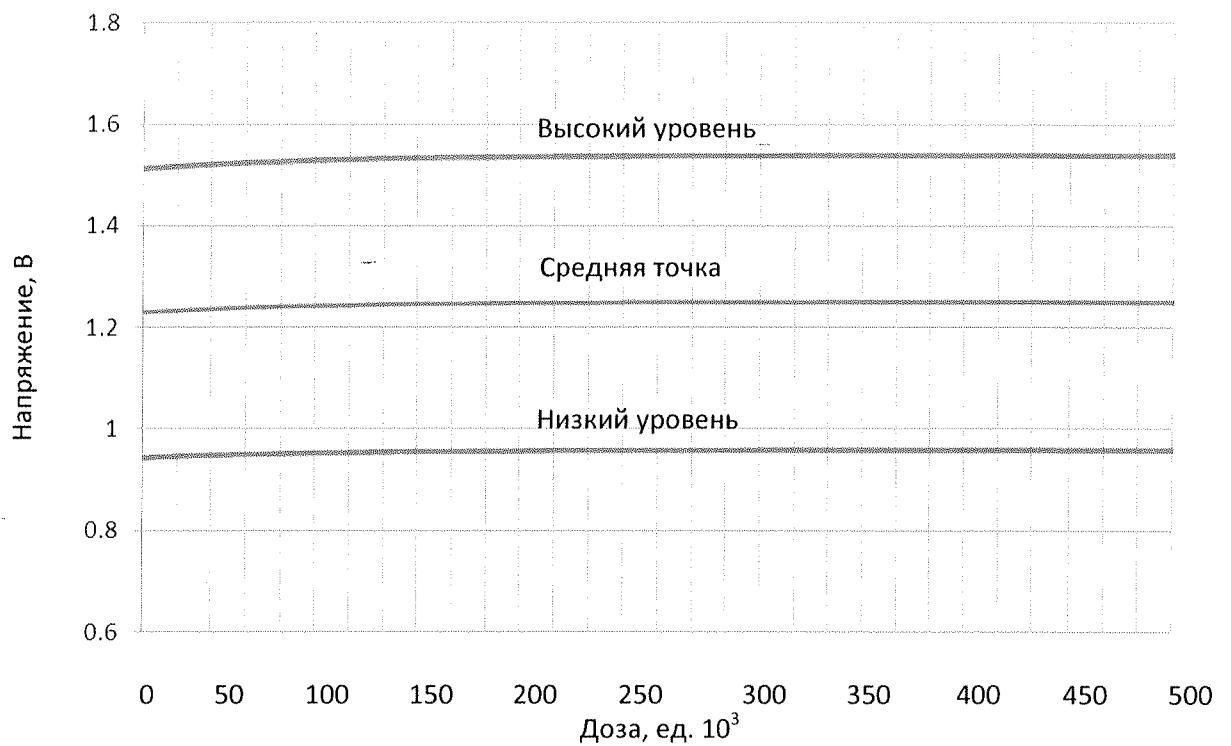


Рисунок 12 – Зависимости уровней выходного сигнала M–LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,3$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1225	Литов. А. А.			

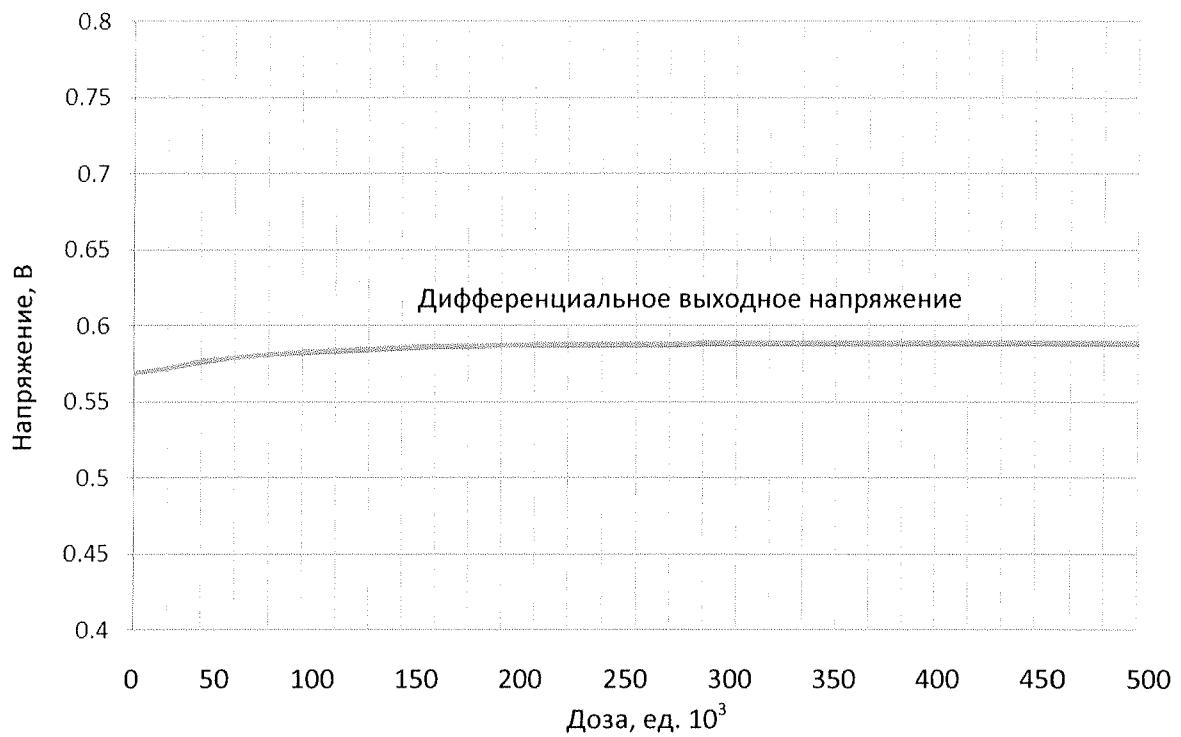


Рисунок 13 – Зависимости дифференциального выходного сигнала М–LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,3$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1425	Диф. вх. дс			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	20
					ГАВЛ.431268.015Д1	

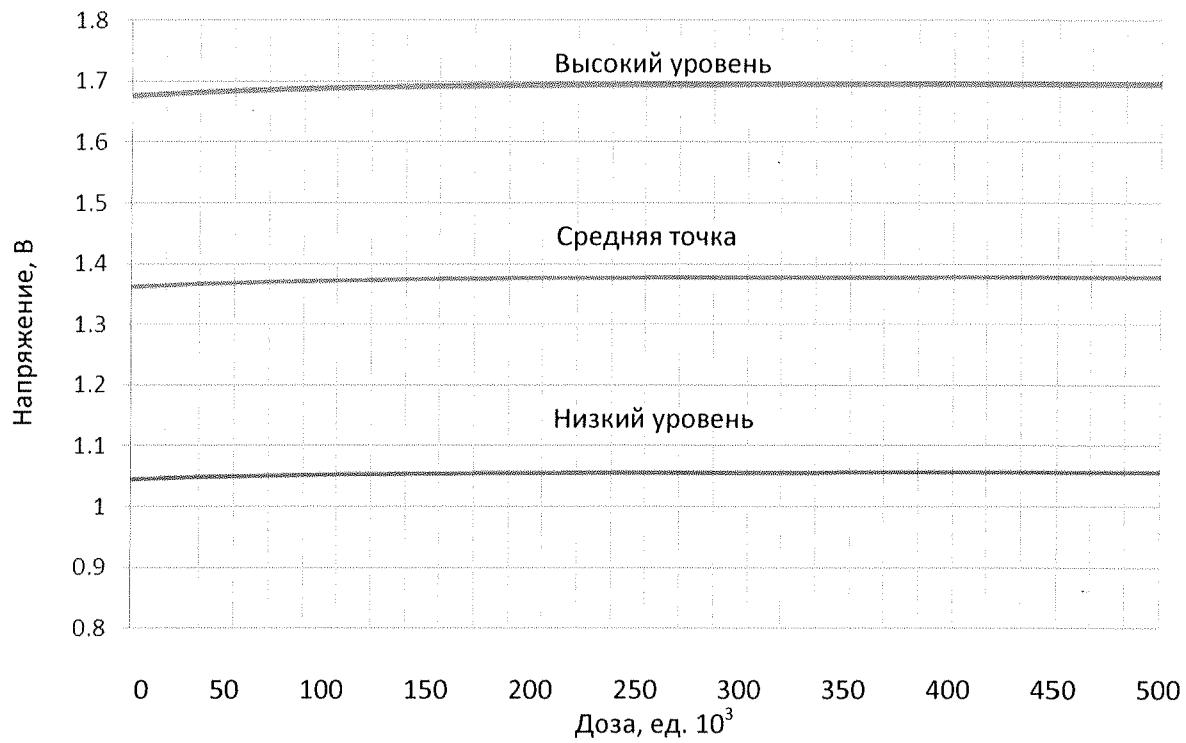


Рисунок 14 – Зависимости уровней выходного сигнала М–LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,63$ В

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ГАВЛ 1305	Гагарин 20.07.2017			

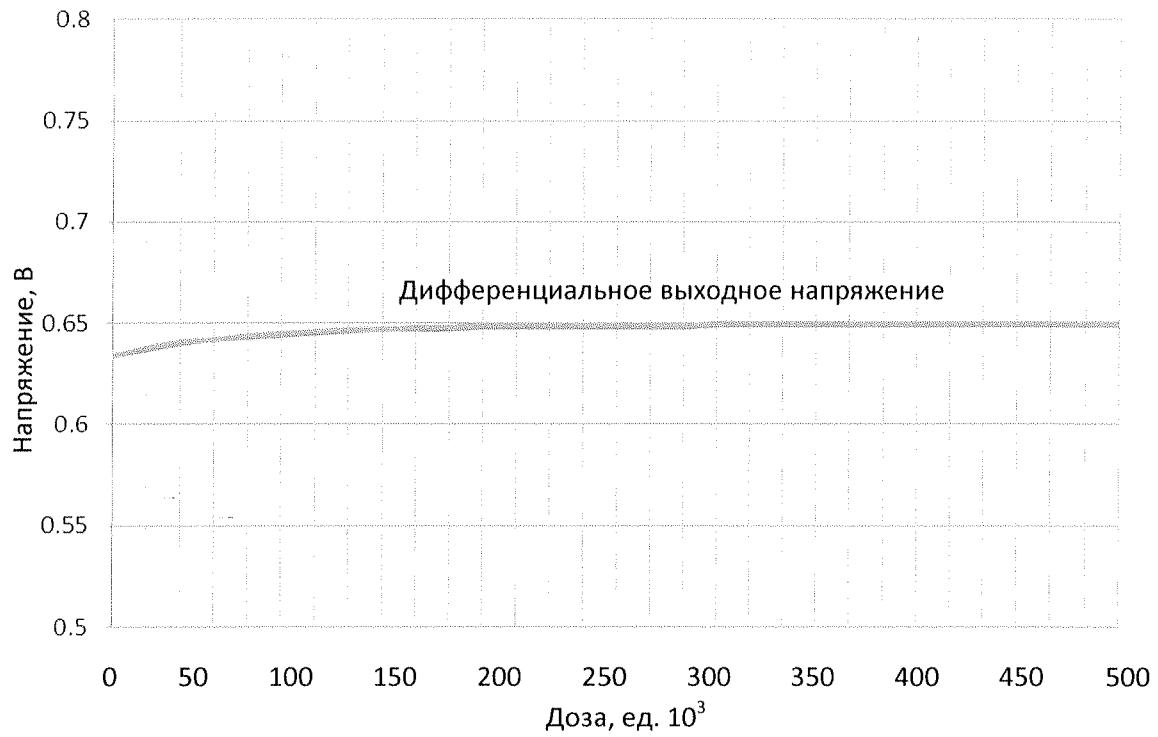


Рисунок 15 – Зависимости дифференциального выходного сигнала М–LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,63$ В

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
Изм. № 15	Изм. № 15			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.015Д1	Лист
						22

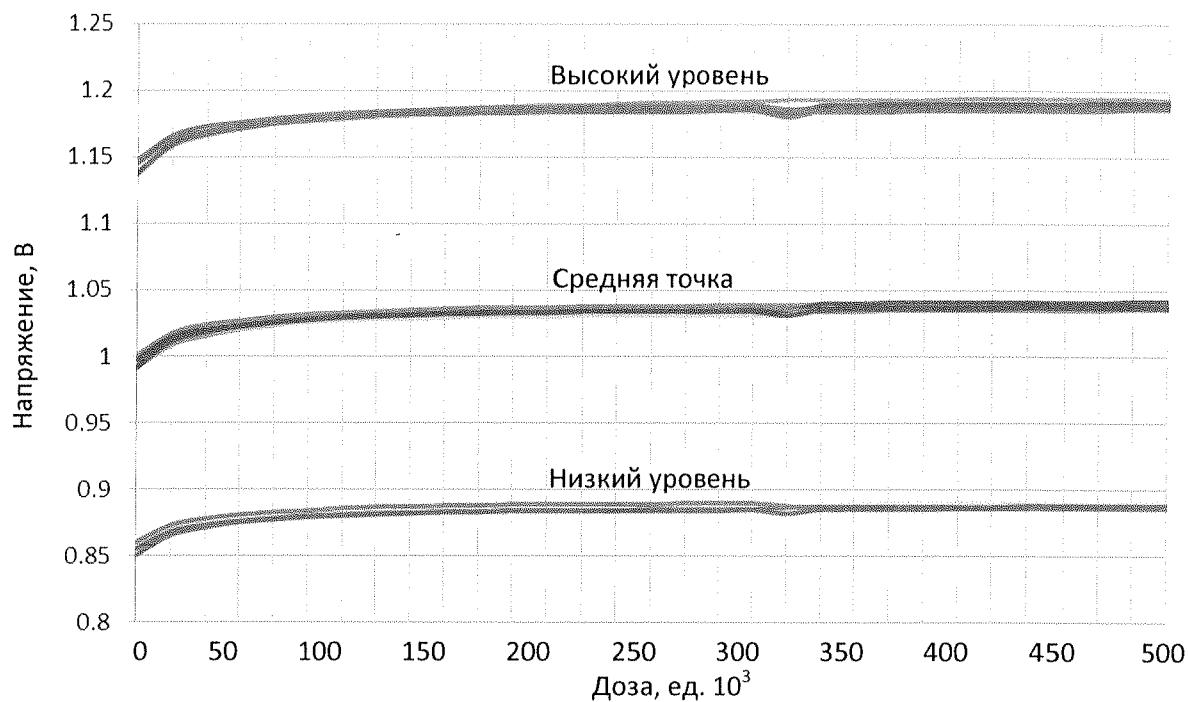


Рисунок 16 – Зависимости уровней выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 2,7$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1385	Литовченко			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.015Д1

Лист
23

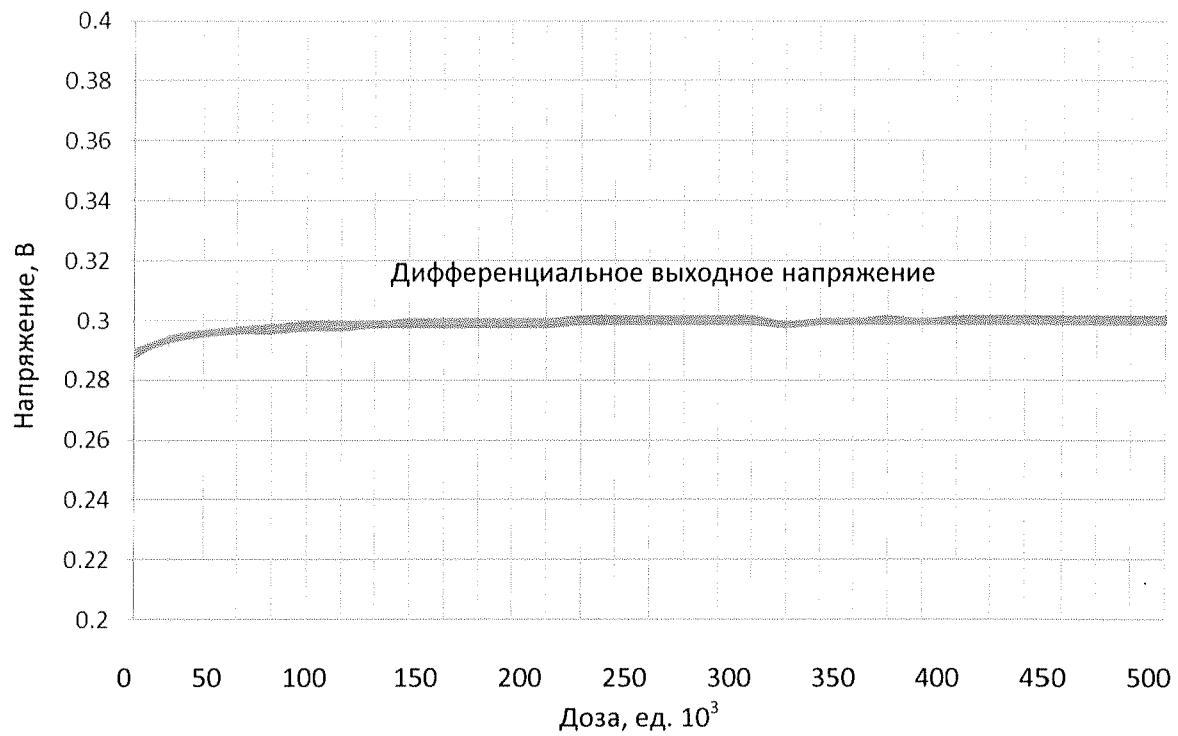


Рисунок 17 – Зависимости дифференциального выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 2,7$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
14625	2016.01.06			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.015Д1			Лист

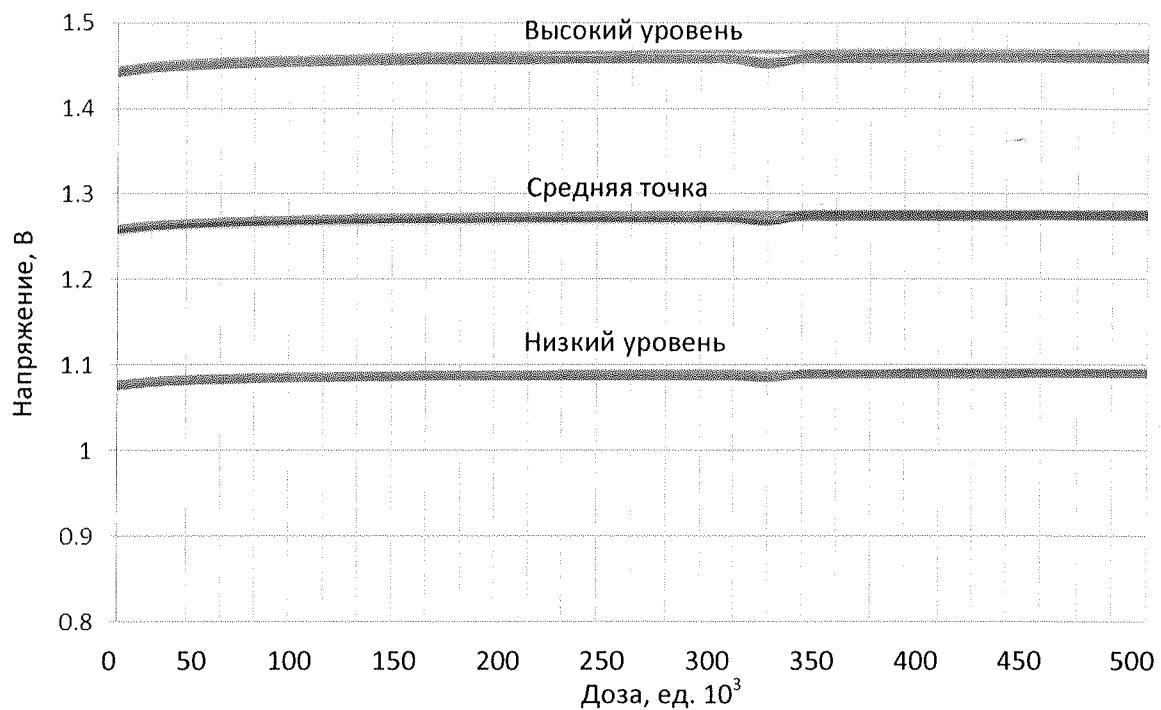


Рисунок 18 – Зависимости уровней выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,3$ В

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
ГАВЛ.431268.015Д1	Документ			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.015Д1	Лист
						25

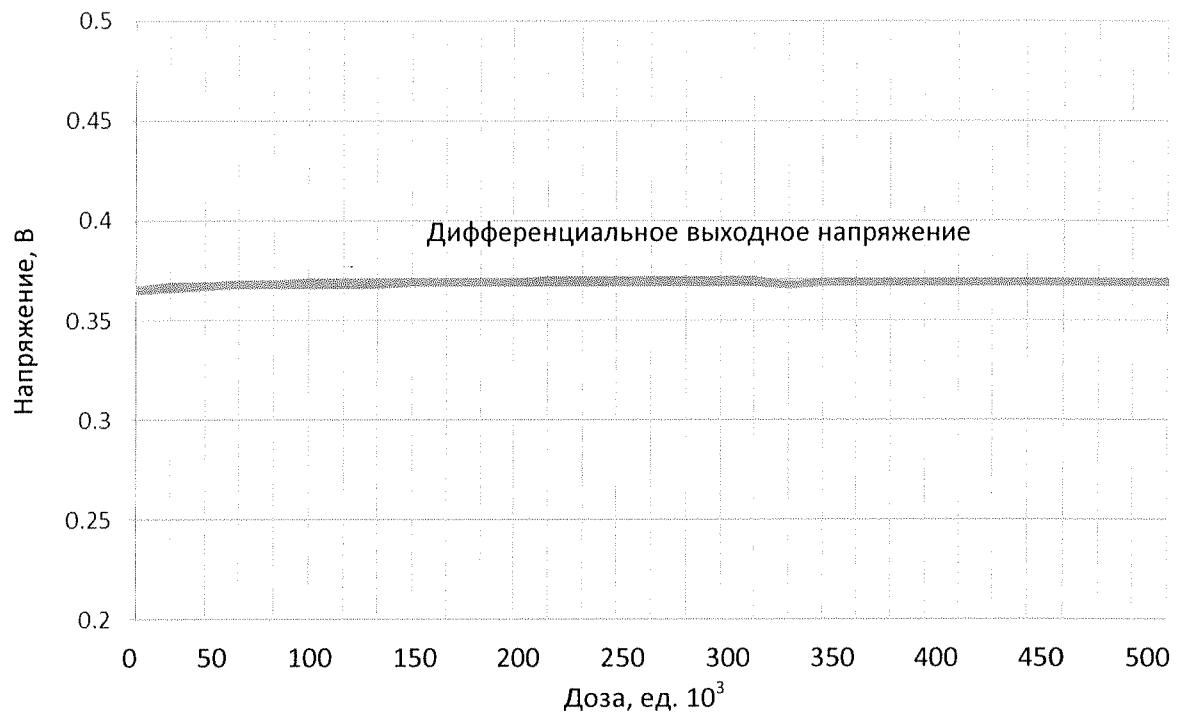


Рисунок 19 – Зависимости дифференциального выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,3$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1225	20.01.06			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					26

ГАВЛ.431268.015Д1

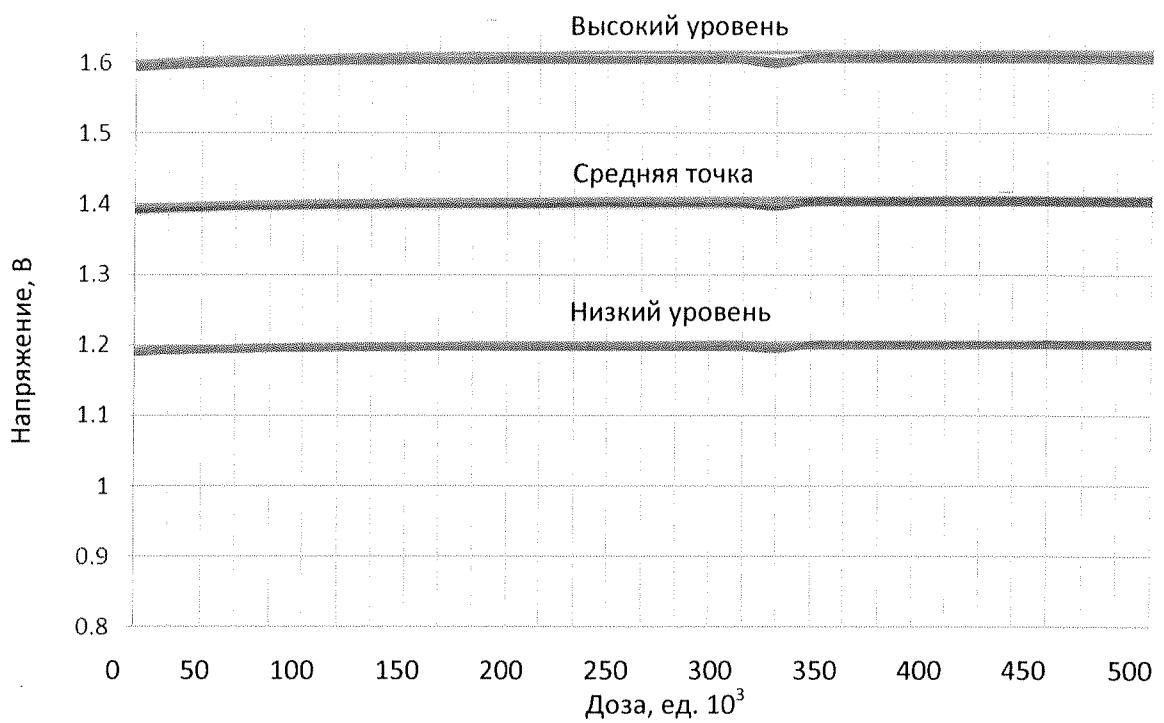


Рисунок 20 – Зависимости уровней выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,63$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ГАВЛ.431268.015Д1	Лист №1			

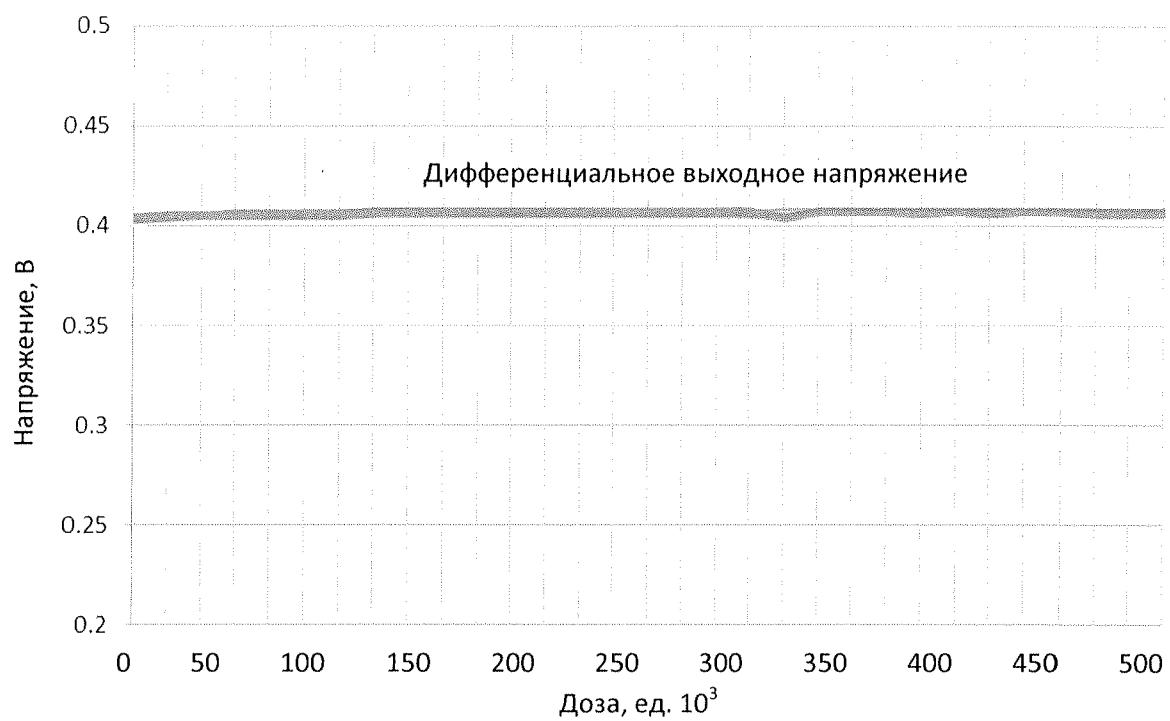


Рисунок 21 – Зависимости дифференциального выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,63$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1495	Гарбовский			

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц)	№ документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
Ильин	Сергей Ильин			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.015Д1			Лист
								29